

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班
碩士論文

應用於 CMOS 電路測試之內建熱加速
自我測試電路



**BIST Burn-in Methodology for the
CMOS Circuit**

研究生：劉坪

指導教授：李崇仁 博士

中華民國九十四年十二月

應用於 CMOS 電路測試之內建熱加速
自我測試電路

**BIST Burn-in Methodology for the
CMOS Circuit**

研究生：劉 坪

Student: Ping Liu


指導教授：李崇仁 教授

Adviser: Prof. Chung Len Lee

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文
A Thesis



Submitted to Institute of Electronics
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Science
in
Electronic Engineering
December 2005
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十四 年 十二 月